XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 2901

2θ(°):開始 = 0.800, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

ステップ = 0.002

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: 遺伝的アルゴリズム データ間隔:1点ごとにフィッティング

母集団: 50 個体数: 50

ターゲットχ²: 1.00e-004

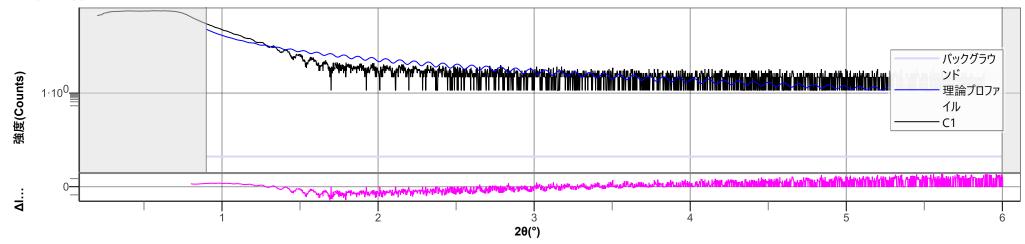
重み: 50%

クロスオーバー: 50%

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 4.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
✓	L4	Fe2O3	1.000	Const	4.95000	Const	5.000	Con
\checkmark	L3	Fe2O3	1.810	Const	4.95000	Const	0.800	Con
\checkmark	L2	Fe Fe	90.505	Const	7.97400	Const	0.500	Con
\checkmark	L1	Fe Fe	0.600	Const	4.50000	Const	0.200	Con
	基板	🖸 Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con